

# Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

## Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17283-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 11.02.2021

Ausstellungsdatum: 11.02.2021

Urkundeninhaber:

**TASCON Gesellschaft für Oberflächen- und Materialcharakterisierung mbH  
Mendelstraße 17, 48149 Münster**

Prüfungen in den Bereichen:

**physikalisch-chemische Analyse der chemischen, elementaren und molekularen Zusammensetzung von Oberflächen, Grenzflächen, oberflächennahen Schichten, komplexen Schichtsystemen, Spurenverunreinigungen und oberflächennahem Volumenmaterial einschließlich der Lateral- und Tiefenverteilung an Festkörpern, Querschnittsflächen, Pulvern, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Lacken mittels Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS); Bestimmung der Rauigkeit von Oberflächen mittels optischer Profilometrie**

**Innerhalb der mit \*\* gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Modifizierung sowie Weiterentwicklung von Prüfverfahren gestattet. Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.**

**Innerhalb der mit \*\*\* gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.**

*Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.*

*Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen>*

**Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17283-01-00**

**1 Bestimmung der chemischen, elementaren und molekularen Zusammensetzung von Oberflächen, Grenzflächen, oberflächennahen Schichten, komplexen Schichtsystemen, Spurenverunreinigungen und oberflächennahem Volumenmaterial einschließlich der Lateral- und Tiefenverteilung an Festkörpern, Querschnittsflächen, Pulvern, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Lacken mittels Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS) \*\***

VA-OG-AM-ToF-SIMS-Spektrenakquisition / 3 2017-02/ 3	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Spektrometrie
VA-OG-AM-ToF-SIMS-Imageakquisition / 3 2017-02	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Imaging
VA-OG-AM-ToF-SIMS-Tiefenprofilakquisition / 2 2017-02	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Tiefenprofilierung
VA-OG-AB-ToF-SIMS-Quantifizierung-von-B-in-Si / 2 2017-02	Quantitativer Nachweis von Bor in Silizium (ToF-SIMS)

**2 Bestimmung der Rauigkeit von Oberflächen mittels optischer Profilometrie \*\*\***

DIN EN ISO 4287 2010-07	Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren - Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit
----------------------------	--

**verwendete Abkürzungen:**

DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
EN	Europäische Norm
ISO	International Organization for Standardization
VA-...	Verfahrensweisung für Hausverfahren der TASCONE GmbH